



**Newsletter vom 12.07.06 der Spar Point Research LLC (Danvers /  
Massachusetts / USA / [www.sparllc.com](http://www.sparllc.com))  
veröffentlicht von Bruce Jenkins, Senior Analyst  
Thema: Kriminaltechnik Workshop "Laserscanner in der Forensik"  
veranstaltet von Z+F, Leica, DelftTech**

Der von Zoller+Fröhlich GmbH, Leica Geosystems GmbH und DelftTech BV veranstaltete Workshop zum Thema "Laserscanner in der Forensik" zog ca. 40 Teilnehmer, davon laut Z+F ca. 30 Endkunden, an. Der Workshop fand vom 3.-4. Mai 2006 in Leipzig in Verbindung mit der 4. Internationalen GPEC Messe (General Police Equipment Exhibition & Conference) statt, welche mehr als 6.000 Besucher verzeichnete.

Laut Z+F gehörten zu den Workshop Referenten seitens der Polizeiinstitutionen Rolf Jäger und Dirk Heisterkamp vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen mit Hauptsitz in Düsseldorf sowie Ursula Buck von der Berner Kantonspolizei.

Zu die akademischen Referenten zählten Prof. Dr. Rudolf Staiger, Fachhochschule Bochum; Prof. Dr.-Ing. Hansjörg Kutterer, Universität Hannover; und Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Niemeier, Universität Braunschweig.

Referenten seitens der Industrie waren u.a. Willem van Spanje, DelftTech BV (Delft, Niederlande); Dr. Marcus Weiss, SpheronVR AG (Waldfischbach-Burgalbern); und Dipl.-Ing. Markus Schäfer, inmetris3D Partnergesellschaft (Braunschweig, Germany).